

## Revista Española de Cardiología



## 4038-8. DISFUNCIÓN DEL ELECTRODO: EL PUNTO DÉBIL DEL DESFIBRILADOR

Victoria Cañadas Godoy, Aida Suárez-Barrientos, Carmen Olmos Blanco, Moisés Pulido Méndez, José Manuel Aguirre Víquez, Nicasio Pérez Castellano, Carlos Macaya Miguel y Julián Pérez-Villacastín de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

## Resumen

**Introducción:** Los DAIs han demostrado disminuir la mortalidad tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Sin embargo, los portadores de DAI están expuestos de por vida al desarrollo de complicaciones por disfunción de alguno de los elementos del sistema, destacando aquellas relacionadas con el electrodo.

**Métodos:** Estudio prospectivo observacional de todos los pacientes a los que se implantó un DAI en nuestro centro (2000-2012) para analizar la incidencia de disfunción del electrodo (DE) a lo largo del seguimiento. Se consideró DE cualquiera de los siguientes supuestos, siempre que requiriera reintervención: 1. Aumento importante del umbral/pérdida de captura, 2. Problemas de sensado o 3. Impedancias anormales.

Resultados: Se implantaron un total de 520 desfibriladores (73% mono, 7% bi y 20% tricamerales). La mediana de seguimiento fue 35 meses (1,7% perdidos). Noventa (17%) pacientes fallecieron a lo largo del seguimiento sin haber presentado DE. Veintiún (4%) pacientes sufrieron algún tipo de DE y 8 de ellos recibieron descargas inapropiadas por este motivo (16% del total de las descargas inapropiadas observadas). En 12 (60%) se efectuó recambio por un nuevo electrodo, 5 (25%) precisaron recolocación y en 2 (10%) se implantó un electrodo adicional para sensado o estimulación, anulando el previo. La probabilidad de estar libre de disfunción del electrodo fue 98% al año, 93% a los 5 años y 91% a los 10 años. La tasa media de incidencia de DE fue 0,8 casos por 100 pacientes-año. Además se analizó la influencia de la marca del electrodo en el riesgo de desarrollar DE y aunque Medtronic presentó la mayor proporción de electrodos disfuncionantes (13/247, 3 de ellos SprintFidelis), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

**Conclusiones:** Aunque la DE es un evento infrecuente en el seguimiento, es causa de la sexta parte de las descargas inapropiadas observadas en nuestra serie, aumentando la morbilidad asociada al DAI.

4038-8.tif

Kaplan-Meier para la supervivencia libre de DE.